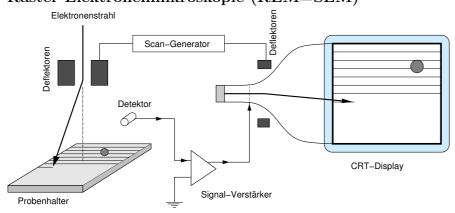
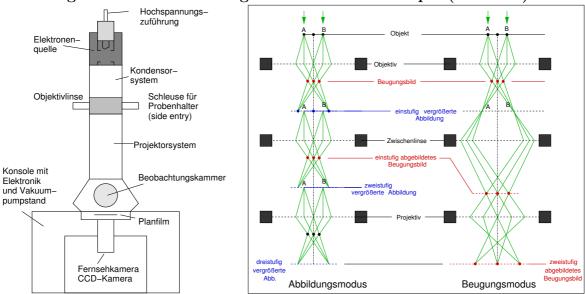
III. Bildgebende Verfahren 1: EM Raster-Elektronenmikroskopie (REM=SEM)

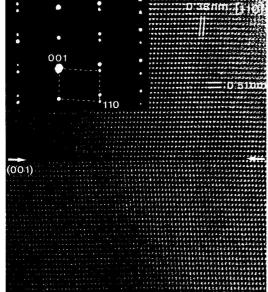


Funktionsprinzip des Rasterelektronenmikroskops

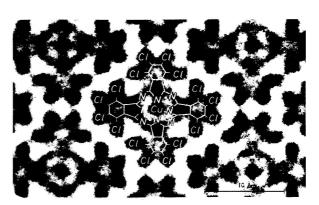
Hochaufgelöste Durchstrahlungs-Elektronenmikroskopie (HRTEM)



Prinzipaufbau des TEM Strahlengänge im TEM



TEM-Aufnahme einer Zwillingsebene (entlang (001)) in YTaO₄ (links oben: Beugungsmuster)



Durchstrahlungsaufnahme von chloriertem Kupferphthalocyanin (500 kV, Aufnahme \perp c-Achse)